Altechna　超低損失ミラー

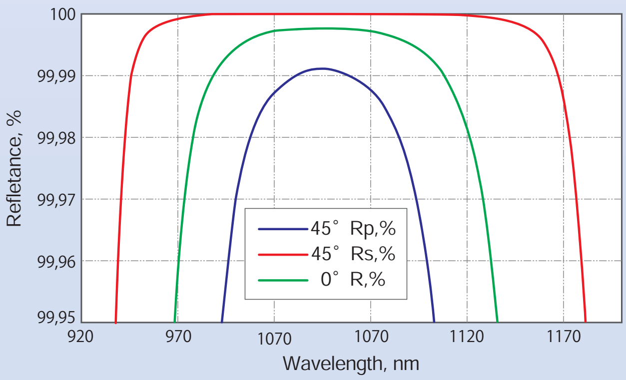
高密度で高いレーザ耐力を持つ成膜が可能なイオンビームスパッタリング(IBS)を用いた超低損失ミラーです。
また、高精度な膜厚の制御が可能です。
さらに、膜物質内に水分を含有しないため高い熱、湿度、圧力下のような耐環境性能に優れております。

波長は343nm～1550nmの間で入射角0°及び45°を取り揃えております。
また、1ヵ月に1000個の生産能力を持ち、特注対応が可能です。

標準仕様

外径：ϕ25.4
外径公差：+0/-0.1 mm
厚さ公差：±0.1 mm
有効径： > 90 %
スクラッチディグ： 20 ～10 S-D
面精度：< λ /8@632.8 nm
面取り：<0.25 mm x 45°
付着力及び耐久性： Per MIL-C-675A

反射率特性(中心波長1030nmの場合)



反射率

入射角0°（ϕ12.5, ϕ25.4, ϕ50.8共通です）

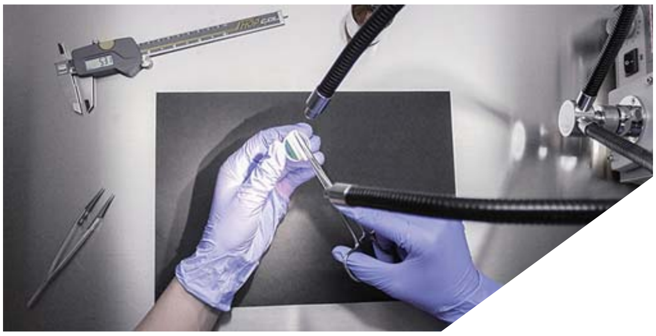
波長 (nm)	343 ～ 355	400	527 ～ 532	800	1030 ～1064	1550
反射率 (%)	>99.9	>99.9	>99.5	>99.99	>99.995	>99.995

入射角45°（ϕ12.5, ϕ25.4, ϕ50.8共通です）

波長 (nm)	343 ～ 355	400	527 ～ 532	800	1030 ～1064	1550
反射率 s / p (%)	>99.9/ >99.7	>99.95/ >99.8	>99.99/ >99.9	>99.995/ >99.95	>99.995/ >99.95	>99.995/ >99.95

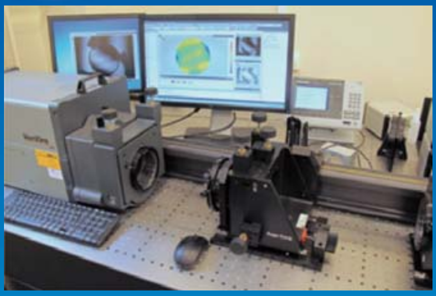
Altechna リトアニア・アルテクナ社

アルテクナはリトアニア国にある高品質のレーザ用光学部品を提供する急成長中のメーカーです。
2000m²の広大な近代的なテクノロジーパークを持ち、お客様の仕様に合わせて設計から製造まで一貫して製作することもできます。
また、最先端の電子ビーム蒸着装置、スパッタリング装置を保有し、優れた品質管理体制も整っております。

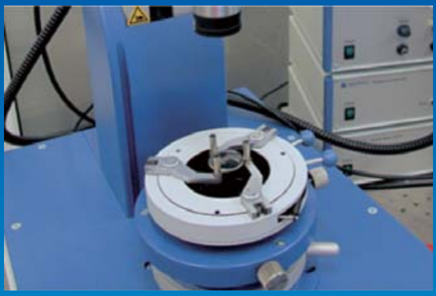


品質管理体制

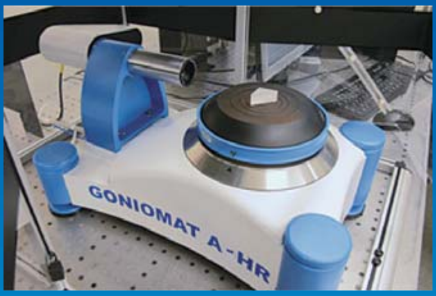
**Altechnaは品質管理を最も重要視しております。
多様な高精度の測定機器を用いてその品質を保っております。**



干 渉 計

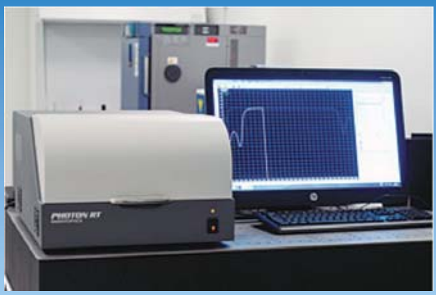


高精度レンズ測定器



ゴニオメーター

郡遅延分散測定器



スペクトロメーター

スクラッチディグ測定器

カンタム エレクトロニクス 株式会社
〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4666 TEL.045-345-0002
info@kantum.co.jp www.kantum.co.jp FAX.045-345-0012

fc-1510-0200Pn